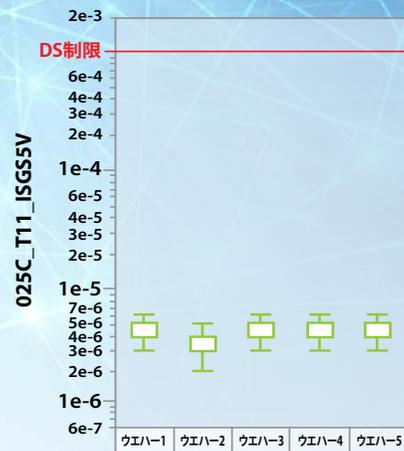


GaNデバイスのテスト情報

EPCは米 **Spirit Electronics** と共同で、製造ロット固有のデータ・サービスの範囲を拡大しています。以下の表に、利用可能なサービスの詳細を示します。以下の表に記載されていない特定の要求がある場合は、info@epc-co.com までご連絡ください。

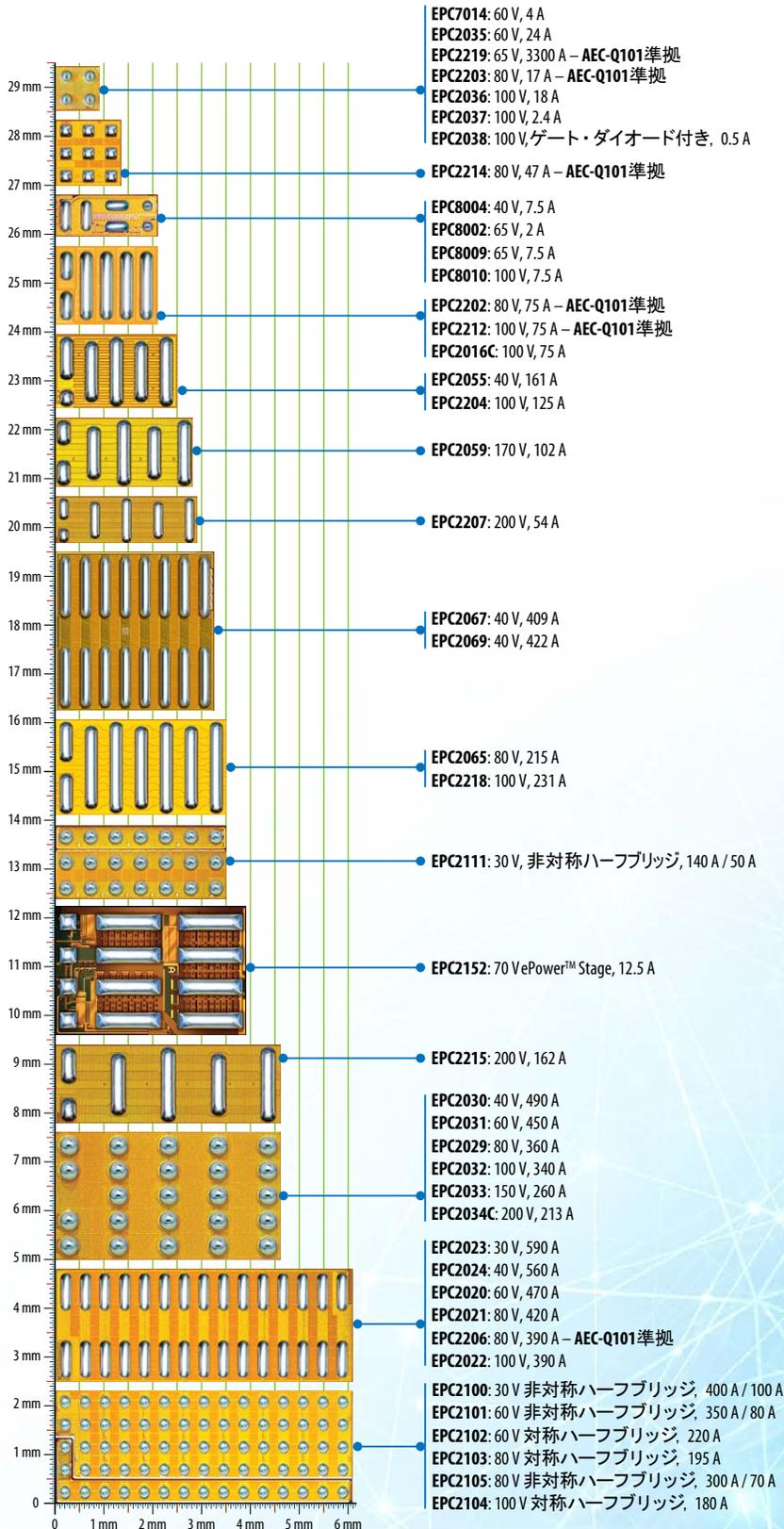
変動性ゲージ
025C_T11_ISGS5Vの変動性図



EPCの商用デバイス向けに提供しているデータ・パック

データ・パック	概要	テスト・パラメータ	データ形式	温度
ロットのデータ・パック	テープ・アンド・リールのロット。ロットの電氣的分布のデータ・パック。(平均、標準偏差、最小、最大)	I_{DSS} (ドレイン・ソース間の漏れ)	平均、標準偏差、最小、最大	25°C
		I_{GSS5V} (ゲート・ソース間の順方向の漏れ)		
		I_{GSSmV} (ゲート・ソース間の逆方向の漏れ) : 適用可能な場合		
		$V_{GS(TH)}$ (ゲートのしきい電圧)		
		$R_{DS(on)}$ (ドレイン・ソース間のオン抵抗)		
シリアル化したロットのデータ・パック	テープ・アンド・リールのチップは、個々に識別。各チップの電気テスト・データのシリアル化したデータ・パックで、25°Cのデータ。	I_{DSS} (ドレイン・ソース間の漏れ)	シリアル化した読み取りと記録	25°C
		I_{GSS5V} (ゲート・ソース間の順方向の漏れ)		
		I_{GSSmV} (ゲート・ソース間の逆方向の漏れ) : 適用可能な場合		
		$V_{GS(TH)}$ (ゲートのしきい電圧)		
		$R_{DS(on)}$ (ドレイン・ソース間のオン抵抗)		
シリアル化したロットのデータ・パック: 高温	テープ・アンド・リールのチップは個々に識別。各チップの電気テスト・データのシリアル化されたデータ・パックで、サンプルを150°C、データ・パックを90°Cで調査。	I_{DSS} (ドレイン・ソース間の漏れ)	シリアル化した読み取りと記録	150°C
		I_{GSS5V} (ゲート・ソース間の順方向の漏れ)		
		I_{GSSmV} (ゲート・ソース間の逆方向の漏れ) : 適用可能な場合		
		$V_{GS(TH)}$ (ゲートのしきい電圧)		
		$R_{DS(on)}$ (ドレイン・ソース間のオン抵抗)		
シリアル化したロットのデータ・パック: 低温	テープ・アンド・リールのチップは、個々に識別。各チップの電気テスト・データのシリアル化したデータ・パックで、-55°Cのデータ。	I_{DSS} (ドレイン・ソース間の漏れ)	シリアル化した読み取りと記録	-55°C
		I_{GSS5V} (ゲート・ソース間の順方向の漏れ)		
		I_{GSSmV} (ゲート・ソース間の逆方向の漏れ) : 適用可能な場合		
		$V_{GS(TH)}$ (ゲートのしきい電圧)		
		$R_{DS(on)}$ (ドレイン・ソース間のオン抵抗)		
目視検査したシリアル化したロットのデータ・パック	テープ・アンド・リールのチップは、個々に識別。各チップの電気テスト・データのシリアル化したデータ・パックで、25°Cのデータ。チップ目視検査のサンプル・データ。	I_{DSS} (ドレイン・ソース間の漏れ)	シリアル化した読み取りと記録	25°C
		I_{GSS5V} (ゲート・ソース間の順方向の漏れ)		
		I_{GSSmV} (ゲート・ソース間の逆方向の漏れ) : 適用可能な場合		
		$V_{GS(TH)}$ (ゲートのしきい電圧)		
		$R_{DS(on)}$ (ドレイン・ソース間のオン抵抗)		
	目視検査のサンプル・データ	シリアル化した写真データ	N/A	
目視検査したシリアル化したロットのデータ・パック: 高温	テープ・アンド・リールのチップは個々に識別。各チップの電気テスト・データのシリアル化されたデータ・パックで、サンプルを150°C、データ・パックを90°Cで調査。チップ目視検査のサンプル・データ。	I_{DSS} (ドレイン・ソース間の漏れ)	シリアル化した読み取りと記録	150°C
		I_{GSS5V} (ゲート・ソース間の順方向の漏れ)		
		I_{GSSmV} (ゲート・ソース間の逆方向の漏れ) : 適用可能な場合		
		$V_{GS(TH)}$ (ゲートのしきい電圧)		
		$R_{DS(on)}$ (ドレイン・ソース間のオン抵抗)		
	目視検査のサンプル・データ	シリアル化した写真データ	N/A	
目視検査したシリアル化したロットのデータ・パック: 低温	テープ・アンド・リールのチップは、個々に識別。各チップの電気テスト・データのシリアル化したデータ・パックで、-55°Cのデータ。チップ目視検査のサンプル・データ。	I_{DSS} (ドレイン・ソース間の漏れ)	シリアル化した読み取りと記録	-55°C
		I_{GSS5V} (ゲート・ソース間の順方向の漏れ)		
		I_{GSSmV} (ゲート・ソース間の逆方向の漏れ) : 適用可能な場合		
		$V_{GS(TH)}$ (ゲートのしきい電圧)		
		$R_{DS(on)}$ (ドレイン・ソース間のオン抵抗)		
	目視検査のサンプル・データ	シリアル化した写真データ	N/A	

価格と在庫状況については、Spirit Electronics にお問い合わせください。



eGaN® FETとIC

より速く、より高効率に、より小型に

